科学研究費補助金研究成果報告書

平成 21 年 05 月 18 日現在

研究種目:若手研究(B)				
研究期間:2007~2008				
課題番号:19760034				
研究課題名(和文) フェムト秒レーザリソグラフィによる無機光学材料での立体構造形成と				
その素子応用				
研究課題名(英文) Femtosecond laser 3-D microfabrication of inorganic materaials and				
its photonic application				
研究代表者				
西山 宏昭(NISHIYAMA HIROAKI)				
大阪大学・大学院工学研究科・助教				
研究者番号:80403153				

研究成果の概要:本研究では,非線形光プロセスを用いることで,半導体プロセスの適用範囲 を従来の平面から立体基板上へと拡張した.フェムト秒レーザパルスをフォトレジスト内部に 集光することで形成した複雑かつ微細なパターンを反応性プラズマによって下地に転写し,無 機光学材料の立体的表面構造を形成した.レジストの非線形光学特性評価を行うとともに, SiO2屈折・回折複合マイクロレンズを試作し,設計通りの光学特性を得た.

交付額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2007 年度	2, 400, 000	0	2, 400, 000
2008 年度	900, 000	270, 000	1, 170, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 300, 000	270, 000	3, 570, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎,応用光学・量子光工学 キーワード:フェムト秒レーザ,非線形光吸収,立体的表面構造,集積光学素子

1. 研究開始当初の背景

回折型微小光学素子は、その優れた光学特 性と集積性から近年、注目が高まっている. 光学部材表面に波長あるいはそれ以下のオ ーダの微細周期構造を形成することで、波長 分散や偏光特性を制御することができる.従 来多用されてきた屈折/反射型素子に比べて 機能設計上の自由度が大幅に増し、光学素子 の高機能化に有用である.中でも、シリカガ ラスなどの無機光学材料をベースとした素 子は、透過性はもとより、物理的・化学的安 定性に優れ、また現行の光デバイスとの高い 親和性から有望である.これら微小光学素子 の多くは、半導体プロセスによって作製され てきた.同プロセスは,機械加工,レーザ直 接加工などに比べて,微細かつ高品質な構造 を形成できるが,一方で,従来,その適用範 囲は平面基板上に制限されており,屈折と回 折機能の融合に有効な立体的表面構造を形 成することは困難であった.

この問題を解決するため,これまでにスプ レーコート法や,多軸自由度を有するステー ジシステムの開発などが報告されている [1,2].しかしながら,これらの手法では,入 射光の線形吸収プロセスを利用しているた め,立体基板上で生じるレジスト変形の影響 を直接に受ける.そのため,精密かつ微細な パターニングを行うためには複雑なシステ ムの導入が必要であった.

2. 研究の目的

本研究では、フェムト秒レーザが誘起する 非線形光プロセスを半導体プロセスへと導 入することで、その適用範囲を立体基板上へ と拡張することを目的とする.これにより、 高品位かつ微細な立体的表面構造の形成が 可能となる.具体的には、フェムト秒レーザ の非線形光吸収特性・感光特性の評価、立体 基板上でのパターニング特性の評価、立体的 表面を有する屈折・回折複合マイクロレンズ の作製・光学特性評価に取り組む.

研究の方法

フォトレジストとして化学増幅型ネガレ ジスト KMPR-1050 およびポジレジスト PMER を用いた.これらレジストのパターニング光 源として,フェムト秒ファイバーレーザ(中 心波長 780 nm,パルス幅127 fs,繰り返し 周波数 100 MHz)を用いた.プラズマエッチ ングは,電子サイクロトロン共鳴プラズマ (CHF₃/0₂混合ガス)でいった.SiO₂薄膜およ び SiN 薄膜はプラズマ化学気相堆積法で合成 した.

4. 研究成果

(1) プロセス提案

図1は、本研究で提案するフェムト秒レー ザ支援マイクロマシニング(FLAM)を模式的 に示している.まず、立体基板上にポジレジ スト PMER を塗布し、その後、フェムト秒レ ーザ誘起非線形光吸収を介してレジスト内 部に直接パターンを書き込む.PEB および現 像によって得たパターンを反応性プラズマ によって下地の層へと転写し、立体的表面を



(c) Patten formation

Figure 1 Schematic image of FLAM for microfabrication on non-flat substrates.

(d) Plasma etching

得る.通常の半導体プロセスにおいては,紫 外光はランバートビア則に従い,レジスト表 面から吸収されていく.このため,精密なパ ターンを得るためには,均一膜厚でのレジス ト塗布が必須である.しかしながら,立体基 板上では,レジストはその表面張力のために 著しく変形する.このことが半導体プロセス の立体基板への適用を阻害している.これに 対し,本プロセスでは,光吸収領域は,レジ スト表面からの距離にはほとんど依存せず, 入射光強度とレジストの持つ強度閾値によ って決まる.このため,基板反射の影響も小 さく,立体基板上であっても精密な構造形成 が期待できる.

(2) パターニング特性評価

レジスト中に形成したパターンの断面図 を図 2(a)に示す. 基板表面を原点としたとき の各パターン形成時のレーザ焦点位置を図 中に示している.レーザ平均出力と走査速度 は,それぞれ 18 mW と 150 µm/s である.パ ターンがレジスト内部に形成されたことが 分かる. PMER はレーザ発振波長 780 nm では ほとんど吸収を持たないが,480 nm 以下の波 長域で光酸発生剤に起因した強い吸収帯を 有する.レーザ焦点位置がパターン高さに与 える影響を図 2(b)に示した.図中の点線は, レジスト膜厚である.パターン高さは,焦点



Figure 2 (a) Cross-sectional images of the resist line patterns and (b) dependence of focal position on pattern height.



Figure3 SEM image of Si line structures across a 65-µm-high step.

位置の光軸方向での移動に伴い,ほぼ線形に 減少した.レジスト表面近傍でやや傾向が異 なるのは,空気とレジスト間での屈折率差に よるものである.出力と走査速度が一定のと き,レジスト中の位置によらず,パターン幅 は,ほぼ同じ値であった.本実験で用いたセ ットアップでは,平均出力 21 mW,走査速度 1500 μm/sのとき,最小線幅 900 nm を得た.

このような非線形リソグラフィー特性を 用いて,高低差 65 µm の段差を有する Si 基 板上に溝構造を形成した.段差試料は KOH 溶 液を用いた異方性エッチングによって作製 した.図3にパターン転写後の SEM 像を示す. 溝の高差位置によらず,5µm の均一ラインが 得られていることが分かる.この線幅は,ス プレーコート法で作製したラインの,およそ 10分の1に相当する.

(3) SiO₂屈折・回折複合レンズ

Si0₂屈折・回折複合レンズを形成するため に,凸レンズ上に調和回折レンズを形成する. 複合レンズの焦点距離は,式(1)から決定す ることが出来る.

 $1/f_h = (1/f_m) + (1/f_F),$ (1)ここで, f_h, f_F, f_mは, それぞれ複合レンズ, 調和レンズ (1次), 凸レンズの焦点距離を示 している.本研究では,焦点距離 2420 µm の 回折レンズを凸レンズ上に形成することで 焦点距離 618 um の複合レンズとした. この とき,最外郭半径は,波長 633 nm 光に対し て 247.5 μm である. 回折レンズは, 異なる 半径を有するリングの重ね合わせで構成さ れており、隣り合うリング間距離は、ビーム 集光径とほぼ同じ 2.0 μm とした. 厚いレジ ストを貫通したパターンを得るため、平面描 画パターンを 3.0 μm 間隔で積層した. 図 4(a) -(c)は、反応性プラズマによって転写した Si0, 複合レンズと、転写前のレジストパター ンの SEM 像である. 下地のレンズ高さによら ず, 鋭いエッジを有するパターンが得られて いることが分かる.得られたレジストパター



Figure 4 SEM images of (a) an overview and (b) a side view of SiO₂-based hybrid lens, and (c) a resist structure.

ン半径は設計値よりも 2.4%大きくなったが、 これは、露光領域のオーバラップによるもの であろう.SiO2構造の表面は滑らかであり, エッチング深さはおよそ 1 µm であった. 波 長 633 nm の He-Ne レーザ光を複合レンズに 垂直入射したところ, 焦点距離は 630 µm で あった. これは複合化前の凸レンズの焦点距 離が 200 µm レンズ側にシフトしたことを意 味しており, 設計値 212 µm に近い. パター ン描画時にリング間距離を 2.0 µm と比較的 大きくしたために,このような集光位置に差 異が生じたと考えられる. FLAM では, 非線形 光吸収を利用しているため,回折限界以下の 高い空間分解能(~100 nm)を得ることが出 来る.また、プラズマでエッチング可能な 種々の材料 (Si, SiN, GaAs など) に適用が 可能である、今後、FLAM の高い空間分解能と

フレキシビリティを利用することで,数百µm の高低差を有する立体的表面構造の形成も 可能となろう.

(4) 結論

無機光学材料の立体的表面構造形成のた めに、非線形リソグラフィーとプラズマエッ チングの複合プロセスである FLAM を報告す るとともに、Si0₂屈折・回折複合レンズを試 作した.立体基板上のレジスト内部にフェム ト秒レーザ誘起非線形光吸収を利用してパ ターンを直接に書き込み、それを反応性プラ ズマによって転写することで立体的表面を 得た.65 μm の高低差を有する段差上であっ ても均一線幅のラインが形成可能であり、ま た、Si0₂複合レンズにおいては、ほぼ設計値 通りの焦点シフト量 200 μm が確認され、FLAM の有効性が示された.今後、露光条件や転写 条件の最適化により、更に微細で複雑な立体 構造の形成が期待できる.

参考文献

[1]V. K. Singh, M. Sasaki, K. Hane, Y. Watanabe, H. Takamatsu, M. Kawakita, and H. Hayashi: J. Micromech. Microeng. 15 (2005) 2339.

[2] D. Radtke and U. D. Zeitner: Opt. Express 15 (2007) 1167.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計9件)

- <u>H. Nishiyama</u>、M. Mizoshiri、J. Nishii,
 Y. Hirata, "Microlens arrays of high refractive index glass fabricated by femtosecond laser lithography", Applied Surface Science (in press), 査 読有.
- ② <u>H. Nishiyama</u>, I. Miyamoto, Y. Hirata, J. Nishii, "Periodic structures of GeO₂-B₂O₃-SiO₂ glass films fabricated using ultraviolet laser pulses", Journal of Physics: Conference Series (in press), 査読有.
- ③ M. Mizoshiri, <u>H. Nishiyama</u>, J. Nishii, Y. Hirata, "SiO₂-based microstructures fabricated by femtosecond laser lithography", Journal of Physics: Conference Series (in press), 査読有.
- ④ <u>H. Nishiyama</u>, "Femtosecond-laser nanolithography for photonic applications", Journal of Nanophotonics, Vol. 3 (2009) art. no. 030301, 査読有.
- (5) M. Mizoshiri, <u>H. Nishiyama</u>, T. Kawahara, J. Nishii, Y. Hirata, "SiO₂-based hybrid diffractive-refractive lenses fabricated"

by femtosecond laser-assisted micromachining", Applied Physics Express, Vol. 1 (2008) art. no. 127001, 査読有.

- ⑥ H. Nishiyama, M. Mizoshiri, T. Kawahara, J. Nishii, Y. Hirata, "SiO₂-based nonplanar structures fabricated by femtosecond laser lithography", Optics Express, Vol. 16 (2008) 17288-17294, 査読有.
- ⑦ M. Mizoshiri, <u>H. Nishiyama</u>, J. Nishii, Y. Hirata, "SiO₂-based variable microfluidic lenses fabricated by femtosecond laser lithography-assisted micromachining", Proceedings of SPIE, Vol. 7039 (2008) art. no. 70390E, 査読 有.
- ⑧ <u>H. Nishiyama</u>, M. Mizoshiri, J. Nishii, Y. Hirata, "Silica-based diffractive-refractive hybrid lenses fabricated by femtosecond laser lithography", Proceedings of SPIE, Vol. 7056 (2008) art. no. 70561F, 査読有.
- ⑨ <u>H. Nishiyama</u>, M. Mizoshiri, J. Nishii, Y. Hirata, "Nonplanar surface structures of inorganic optical materials fabricated by femtosecond laser lithography", Proceedings of SPIE, Vol. 6883 (2008) art. no. 68830E, 査読 有.

〔学会発表〕(計6件)

- ① 西山宏昭,伊庭知宏,溝尻瑞枝,平田好則,"フェムト秒レーザリソグラフィーによる針構造先端へのカーボンナノチューブ合成",レーザー学会学術講演会第29回年次大会,2009年1月,徳島大学。
- ② 溝尻瑞枝,西山宏昭,西井準治,平田好則,"フェムト秒レーザリソグラフィーによるマイクロ流路内へのシリカガラス製微小光学素子の作製",レーザー学会学術講演会第29回年次大会,2009年1月,徳島大学.
- ③ 溝尻瑞枝,西山宏昭,西井準治,平田好則,"フェムト秒レーザ支援マイクロマシニングによるマイクロ流路内への無機材料製微小光学素子の作製",第25回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム,2008年10月,沖縄コンベンションセンター.
- ④ 菅原晃佳,西山宏昭,溝尻瑞枝,西井準治,笠春也,平田好則,"フェムト秒レーザリソグラフィーによる無機高屈折率材料での微小光学素子形成",第69回応用物理学会学術講演会,2008年9月,中部大学.

- ⑤ 伊庭知宏,西山宏昭,溝尻瑞枝,西井準治,平田好則,"カーボンナノチューブの針状電極先端への合成とその電界放出特性評価",第69回応用物理学会学術講演会,2008年9月,中部大学.
- ⑥ 伊庭知宏,西山宏昭,溝尻瑞枝,西井準治,平田好則,"フェムト秒レーザリソグラフィーによる針状電極先端へのカーボンナノチューブ合成",第70回レーザ加工学会講演会,2008年5月,大阪大学.
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
 西山 宏昭(NISHIYAMA HIROAKI)
 大阪大学・大学院工学研究科・助教
 研究者番号:80403153